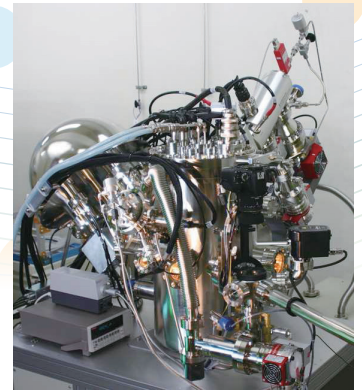


ESCA (XPS)

X線光電子分光分析

半額キャンペーン

ESCAは表面数nmに存在する元素や化学状態を調べる手法です。表面処理評価や汚染分析などが可能で、イオンスパッタとの併用により積層膜の組成もわかります。有機膜のスパッタに適したArガスクラスターイオンビーム(GCIB)もご用意しています。2試料以上で半額とするキャンペーンを実施します。表面分析をご検討中のお客様、この機会にESCAをぜひお試しください。



分析例 ステンレス材料の解析

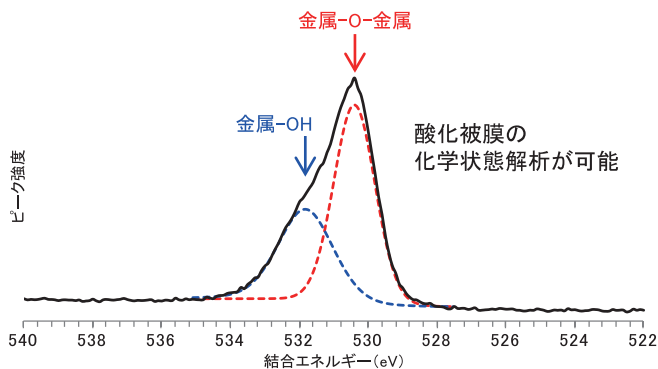


図 市販ステンレス材料のO1s波形分離スペクトル (GCIBクリーニング後)

推定成分	ピーク面積比 (%)
金属-O-金属	60
金属-OH	40

- 表面のクリーニング
- 表面の分析
- ピーク分離・解析

2試料
¥210,000
キャンペーン価格

50% OFF!!
¥105,000

分析例 高分子膜の深さ方向分析

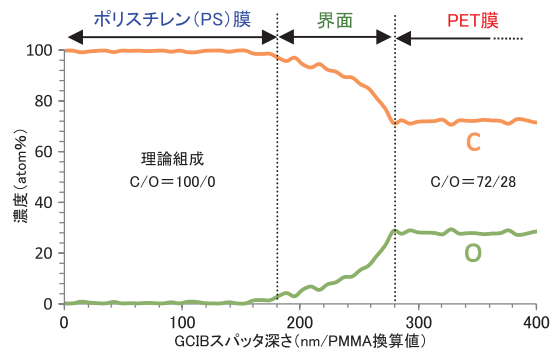
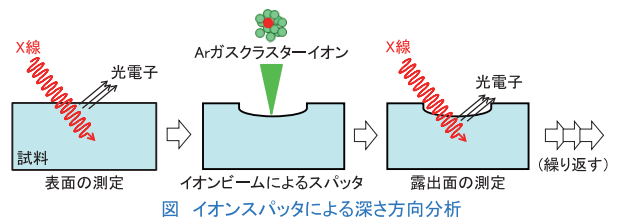


図 PS/PET膜のデプスプロファイル

- 表面の分析
- GCIB深さ方向分析 (400nm)
- デプスプロファイルの作成 (化学状態の解析は含まれていません)

2試料
¥580,000
キャンペーン価格

50% OFF!!
¥290,000

キャンペーンご依頼の条件と注意事項

1. 10月1日～12月25日までに、ご発注及びサンプルを弊社が受領できることとします。
2. 試料数量は2試料以上とさせていただきます。
3. お受けするキャンペーン数量には限りがあります。期間内でもお受けできない場合がございますことをご了承願います。
4. お問い合わせは「ESCAキャンペーン」とお伝えください。
5. 同業者からのご依頼は対象外とさせていただきます。

お問合せ先

E-mail eigyou@tosoh-arc.co.jp

株式会社 東ソー分析センター 営業部 〒105-0014 東京都港区芝1-4-10 トイヤビル6階 TEL 03-6435-4321